

曲线图示仪在片测试系统

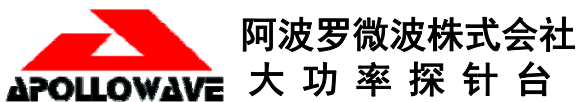
轻松实现晶圆在片测试、切割芯片测试以及各类封装品测试
实时曲线扫描，研发、质检、失效分析不可或缺
适用于Si、SiC、GaN等各类材料的
IGBT、MOSFET、三极管、二极管等半导体元器件



超高电压晶圆自动测试系统，原厂成品控制软件、硬件配套。

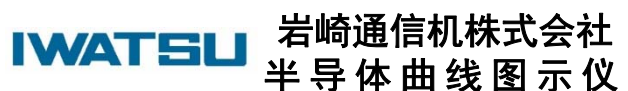
实现手动装片并定位后全自动：

寻址、下针、测试、合格判断/分档、打印标记、晶圆图标识、数据导出。



阿波罗微波株式会社
大功率探针台

对应晶圆：12英寸max 向下兼容至芯片级
对应电压：30kVmax
对应电流：400Amax
对应温度：-55°C ~ 350°C



岩崎通信株式会社
半导体曲线图示仪

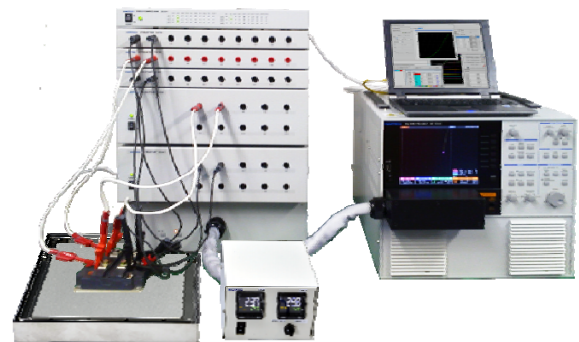
特点：实时跟踪扫描、内置多种电源
集漏电测试与大电流测试于一体
性能：15kVmax、8000Amax
温度：-55°C ~ 350°C



手动针台

便携式针台

半自动针台



多合一器件全自动温控扫描系统

